

諮問事項に係る新旧対照表

1. 温度（放射温度計（-30 ~ 160））

特定標準器 （法第134条第1項）	特定副標準器 （法第134条第2項）	校正等の実施（法第135条第1項）	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
温度定点群実現装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 （ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所）	赤外放射温度計であって、校正範囲が-30以上160以下のもの

：諮問事項

2. 温度（放射温度計（2000 ~ 2800））

現行

特定標準器 （法第134条第1項）	特定副標準器 （法第134条第2項）	校正等の実施（法第135条第1項）	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
温度定点群実現装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	放射温度計校正用の垂鉛点実現装置、アルミニウム点実現装置、銀点実現装置、銅点実現装置又は単色放射温度計であって、日本電気計器検定所が保管するもの	日本電気計器検定所	放射温度計校正用の垂鉛点実現装置、アルミニウム点実現装置、銀点実現装置、銅点実現装置又は単色放射温度計であって、校正範囲が400以上2000以下のもの

改正

特定標準器 （法第134条第1項）	特定副標準器 （法第134条第2項）	校正等の実施（法第135条第1項）	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
温度定点群実現装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	放射温度計校正用の垂鉛点実現装置、アルミニウム点実現装置、銀点実現装置、銅点実現装置又は単色放射温度計であって、日本電気計器検定所が保管するもの	日本電気計器検定所	放射温度計校正用の垂鉛点実現装置、アルミニウム点実現装置、銀点実現装置、銅点実現装置又は単色放射温度計であって、校正範囲が400以上2800以下のもの

：諮問事項

3. 流量・流速（気体小流量）

現行

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施（法第135条第1項）	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
気体流量校正設備であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	気体流量校正装置であって、校正範囲が 0.005 g/min 以上 <u>180 g/min</u> 以下のもの又は ISO 型トロイダルスロート音速ノズルであって、校正範囲が 0.005 g/min 以上 20 kg/min 以下のもの

改正

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施（法第135条第1項）	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
気体流量校正設備であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	気体流量校正装置であって、校正範囲が 5 mg/min 以上 <u>400 g/min</u> 以下のもの又は ISO 型トロイダルスロート音速ノズルであって、校正範囲が 5 mg/min 以上 20 kg/min 以下のもの

_____ : 諮問事項

4. 高周波インピーダンス (9kHz ~ 0.04 GHz)

現行

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施 (法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
標準終端器群であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	減衰器、エアライン、ミスマッチライン又は終端器のうち、これらの線路が同軸構造を有し、かつ、その外部導体の内径が7mmのものであって、9kHz以上0.04GHz未満の周波数の高周波信号を当該線路に通した場合において、入射波の強度に対する反射波の強度の比を示す数値又は入射波の強度に対する透過波の強度の比を示す数値が1以下であるもの

改正

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施 (法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
標準終端器群であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	減衰器、エアライン、ミスマッチライン又は終端器のうち、これらの線路が <u>N型同軸構造を有するもの及び同軸構造を有し、かつ、その外部導体の内径が3.5mm及び7mmのものであって、9kHz以上0.04GHz未満の周波数の高周波信号を当該線路に通した場合において、入射波の強度に対する反射波の強度の比を示す数値又は入射波の強度に対する透過波の強度の比を示す数値が1以下であるもの</u>

_____ : 諮問事項

5. 高周波インピーダンス (0.04 GHz ~)

現行

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施 (法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
標準エアライン群であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	減衰器、エアライン、ミスマッチライン又は終端器のうち、 <u>線路が3.5 mm同軸構造を有するものであって、周波数が0.1 GHz以上33 GHz以下の場合において、入射波と反射波との比又は入射波と透過波との比が1以下であるもの並びに線路がN型同軸構造を有するもの及び線路が7 mm同軸構造を有するものであって、周波数が0.04 GHz以上18 GHz以下の場合において、入射波と反射波との比又は入射波と透過波との比が1以下であるもの</u>

改正

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
標準エアライン群 であって、国立研究 開発法人産業技術 総合研究所が保管 するもの		経済産業大臣 (ただし、法第1 68条の2の規定 により国立研究開 発法人産業技術総 合研究所)	減衰器、エアライン、ミ スマッチライン又は終端 器のうち、 <u>これらの線路 が同軸構造を有し、かつ、 その外部導体の内径が 3.5 mm のものであって、 0.04 GHz 以上 33 GHz 以 下の周波数の高周波信号 を当該線路に通した場合 において、入射波の強度 に対する反射波の強度の 比を示す数値又は入射波 の強度に対する透過波の 強度の比を示す数値が1 以下であるもの並びに線 路がN型同軸構造を有す るもの及び同軸構造を有 し、かつ、その外部導体 の内径が7 mm のもので あって、0.04 GHz 以上 18 GHz 以下の周波数の高周 波信号を当該線路に通し た場合において、入射波 の強度に対する反射波の 強度の比を示す数値又は 入射波の強度に対する透 過波の強度の比を示す数 値が1以下であるもの</u>

_____ : 諮問事項

6. 高周波減衰量

現行

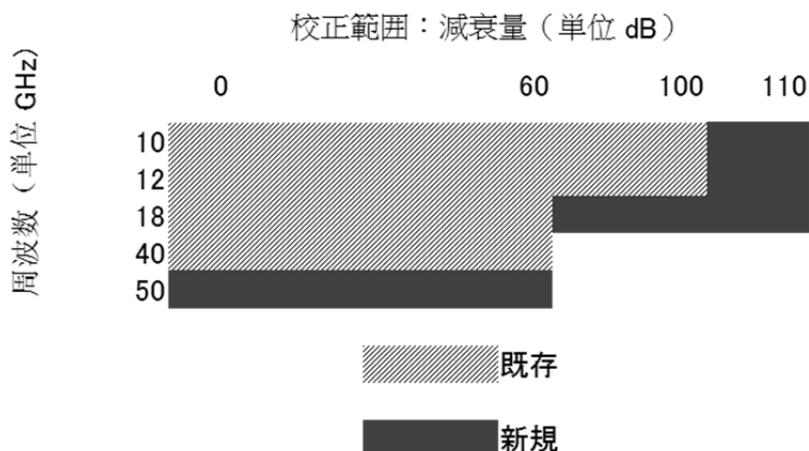
特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
標準減衰量測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	ピストン減衰器であって、 <u>周波数が30 MHzの場合において、校正範囲が100 dB以下のもの、可変減衰器であって、周波数が10 MHz以上12 GHz以下の場合において、校正範囲が100 dB以下のもの若しくは周波数が12 GHzを超え40 GHz以下の場合において、校正範囲が60 dB以下のもの又は同軸固定減衰器であって、校正範囲が60 dBを超え80 dB以下の場合において、周波数範囲が10 MHz以上18 GHz以下のもの若しくは校正範囲が60 dB以下の場合において、周波数範囲が10 MHz以上40 GHz以下のもの</u>

改正

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
標準減衰量測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	ピストン減衰器であって、 <u>30 MHzの周波数の高周波信号を当該線路に通した場合において、校正範囲が100 dB以下のもの、可変減衰器のうち、線路が同軸構造を有するものであって、10 MHz以上18 GHz以下の周波数の高周波信号を当該線路に通した場合において、校正範囲が110 dB以下のもの及び18 GHzを超え50 GHz以下の周波数の高周波信号を当該線路に通した場合において、校正範囲が60 dB以下のもの並びに固定減衰器のうち、線路が同軸構造を有するものであって、10 MHz以上18 GHz以下の周波数の高周波信号を当該線路に通した場合において、校正範囲が60 dBを超え80 dB以下のもの及び10 MHz以上40 GHz以下の周波数の高周波信号を当該線路に通した場合において、校正範囲が60 dB以下のもの</u>

_____ : 諮問事項

高周波減衰量の校正範囲と校正実施条件(周波数)の範囲



7. 高周波移相量

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
標準減衰量測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		<u>経済産業大臣</u> (ただし、 <u>法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所</u>)	<u>可変移相器のうち、線路が同軸構造を有するものであって、10 MHz以上1 GHz以下の周波数の高周波信号を当該線路に通した場合において、減衰量が60 dB以下のもの</u>

_____ : 諮問事項

8. アンテナ係数

現行

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
標準アンテナ群であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	固定長エレメント型のダイポールアンテナであって、周波数が30 MHz以上1 GHz以下のもの

改正

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
標準アンテナ群であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	<u>ループアンテナであって、電磁波の周波数が9 kHz以上30 MHz以下のもの、バイコニカルアンテナであって、電磁波の周波数が30 MHz以上300 MHz以下のもの、ログペリオディックアンテナであって、電磁波の周波数が300 MHz以上1 GHz以下のもの並びにボウタイアンテナとログペリオディックアンテナの複合アンテナ及び固定長エレメント型のダイポールアンテナであって、電磁波の周波数が30 MHz以上1000 MHz以下のもの</u>

_____ : 諮問事項

9. 高周波レーザーパワー

現行

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
カロリメータ方式レーザーパワー測定装置標準アンテナ群であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	レーザービーム用熱型光パワー測定装置であって、 <u>波長が488 nm又は515 nmの場合においては、校正範囲が10 mW以上200 mW以下、633 nmの場合においては、校正範囲が50 μW以上10 mW以下若しくは1550 nmの場合においては、校正範囲が50 μW以上1 mW以下のもの</u>

改正

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
カロリメータ方式レーザーパワー測定装置標準アンテナ群であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	レーザービーム用熱型光パワー測定装置であって、 <u>波長が405 nm帯の場合において校正範囲が50 μW以上10 mW以下のもの、波長が488 nm及び515 nmの場合においては、校正範囲が10 mW以上200 mW以下のもの、波長が633 nmの場合においては、校正範囲が50 μW以上10 mW以下のもの並びに波長が1550 nmの場合においては、校正範囲が50 μW以上1 mW以下のもの</u>

_____ : 諮問事項

10. 熱中性子フルエンス率

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
<u>熱中性子フルエンス絶対測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの</u>		<u>経済産業大臣(ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)</u>	<u>熱中性子測定器のうち、中性子フルエンス率の校正範囲が、$50 \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$以上 $10000 \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$以下のもの</u>

_____ : 諮問事項

11. 中性子放出率

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
<u>中性子放出率基準測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの</u>		<u>経済産業大臣(ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)</u>	<u>中性子放出率測定器のうち、中性子線源がアメリカシウム241-ベリリウム又はカリフォルニウム252の場合において校正範囲が 1000 s^{-1}以上 1000000 s^{-1}以下のもの</u>

_____ : 諮問事項

12. 基準空気カーマ率

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
<u>密封小線源カーマ率設定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの</u>		<u>経済産業大臣(ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)</u>	<u>カーマ率校正用の井戸型電離箱式線量計であって、線源の核種がよう素125の場合において、校正範囲が空気カーマ率について $0.3 \mu\text{Gy/h}$以上 $15 \mu\text{Gy/h}$以下のもの</u>

_____ : 諮問事項

13. 高エネルギー光子線水吸収線量

現行

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
グラフィットカロリメータ及びグラフィット壁空洞電離箱式照射線量設定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	吸収線量又は吸収線量率を計量する計量器を校正するために用いられる線水吸収線量用電離箱式線量計であって、0.1 Gy以上220 Gy以下の一定の水吸収線量(コバルト60を線源として用いる場合における当該線源から発せられる線に係る水吸収線量をいう。)を計量するもの

改正

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
グラフィットカロリメータ及びグラフィット壁空洞電離箱式照射線量設定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	<p>吸収線量又は吸収線量率を計量する計量器を校正するために用いられる線水吸収線量用電離箱式線量計であって、0.1 Gy以上220 Gy以下の一定の水吸収線量(コバルト60を線源として用いる場合における当該線源から発せられる線に係る水吸収線量をいう。)を計量するもの</p> <p><u>吸収線量を計量する計量器を校正するために用いられる水吸収線量用電離箱式線量計であって1 Gy以上200 Gy以下の一定の水吸収線量(公称加速電圧が6 MV、10 MV及び15 MVで加速された電子により生じた光子線の水吸収線量をいう)を計量するもの</u></p>

_____ : 諮問事項

14. ロックウエル硬さ

現行

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
ロックウエル硬さ標準機であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	<u>ロックウエル硬さ基準機</u> 又は <u>ロックウエル硬さ標準片</u> であって、校正範囲が20 HRC以上65 HRC以下のもの

改正

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
ロックウエル硬さ標準機であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	ロックウエル硬さ標準片であって、校正範囲が20 HRC以上65 HRC以下のもの

_____ : 諮問事項

15. ビッカース硬さ

現行

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
ビッカース硬さ標準機であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	<u>ビッカース硬さ基準機</u> 又は <u>ビッカース硬さ標準片</u> であって、校正範囲が200 HV以上900 HV以下のもの

改正

特定標準器 (法第134条第1項)	特定副標準器 (法第134条第2項)	校正等の実施(法第135条第1項)	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う計量器
ビッカース硬さ標準機であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの		経済産業大臣 (ただし、法第168条の2の規定により国立研究開発法人産業技術総合研究所)	ビッカース硬さ標準片であって、校正範囲が200 HV以上900 HV以下のもの

_____ : 諮問事項

16. 標準物質（濃度：標準ガス）

現行

特定標準物質を製造するための器具、機械又は装置（法第134条第1項）	特定標準物質	校正等の実施（法第135条第1項）	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う標準物質
標準ガスを製造するための標準ガス製造用精密天びん、標準ガス調製装置及び分析計測装置（以下、「標準ガス製造装置」という。）であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管するもの	エタノール標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの	一般財団法人化学物質評価研究機構	エタノール標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が <u>100 vol ppm 以上</u> 500 vol ppm 以下のもの及び空気希釈のものであって、濃度が <u>100 vol ppm 以上</u> 500 vol ppm 以下のもの

改正

特定標準物質を製造するための器具、機械又は装置（法第134条第1項）	特定標準物質	校正等の実施（法第135条第1項）	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う標準物質
標準ガスを製造するための標準ガス製造用精密天びん、標準ガス調製装置及び分析計測装置（以下、「標準ガス製造装置」という。）であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管するもの	エタノール標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの	一般財団法人化学物質評価研究機構	エタノール標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が <u>20 vol ppm 以上</u> 500 vol ppm 以下のもの及び空気希釈のものであって、濃度が <u>20 vol ppm 以上</u> 500 vol ppm 以下のもの

： 諮問事項

17. 標準物質（濃度：非金属イオン標準液）

新規

特定標準物質を製造するための器具、機械又は装置（法第134条第1項）	特定標準物質	校正等の実施（法第135条第1項）	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う標準物質
標準液を製造するための標準液製造用精密天びん、超純水製造装置及び分析計測装置（以下、「標準液製造装置」という。）であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管するもの	<u>臭素酸イオン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの</u>	一般財団法人化学物質評価研究機構を予定	<u>臭素酸イオン標準液であって、濃度が2g/Lのもの</u>
	<u>塩素酸イオン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの</u>		<u>塩素酸イオン標準液であって、濃度が1g/Lのもの</u>

_____： 諮問事項

18. 標準物質（濃度：有機標準液）

新規

特定標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置 (法第134条第1項)	特定標準物質	校正等の実施（法第135条第1項）	
		校正等を行う者	特定標準器による校正等を行う標準物質
標準液を製造するための標準液製造用精密天びん及び分析計測装置（以下、「有機標準液製造装置」という。）であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管するもの	<u>揮発性有機化合物25種混合標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの</u>	<u>一般財団法人化学物質評価研究機構</u>	<u>揮発性有機化合物25種混合標準液のうちメタノール希釈のものであって、ジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、四塩化炭素、クロロホルム、トリブロモメタン、ブロモジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、cis-1,2-ジクロロエチレン、trans-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、cis-1,3-ジクロロプロペン、trans-1,3-ジクロロプロペン、1,4-ジクロロベンゼン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、ベンゼン、トルエン、1,4-ジオキサン及びt-ブチルメチルエーテルの各濃度が1 g/Lのもの)</u>

： 諮問事項

(注) 本混合標準液は、既存の「揮発性有機化合物23種混合標準液」に1,4-ジオキサン及びt-ブチルメチルエーテルを加えたもの。(既存混合標準液は維持される。)